

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 11, 2013

Описание разрешения нейтронного порошкового дифрактометра с фокусирующим монохроматором при ненулевом угле Фанкухена <i>В. И. Бобровский</i>	5
Термостабильность органических слоистых систем на основе стеарата свинца <i>М. А. Марченкова, Ю. А. Дьякова, А. Ю. Серегин, А. С. Орехов, В. В. Клечковская, Л. Р. Имамова, Е. Ю. Терещенко</i>	14
Особенности трансформации наноалмазов детонационного синтеза в луковичнообразные углеродные наночастицы <i>В. А. Попов, А. В. Егоров, С. В. Савилов, В. В. Лунин, А. Н. Кириченко, В. Н. Денисов, В. Д. Бланк, О. М. Вяселев, Т. Б. Сагалова</i>	20
Проекционная рентгеновская дифракционная топография – возможности количественного анализа изображений дефектов <i>Э. В. Суворов, И. А. Смирнова</i>	30
Рентгенографическое исследование структуры слоя насыпной насадки, ограниченной цилиндрической поверхностью <i>А. С. Пушинов, К. В. Чиж, М. Г. Беренгартен</i>	34
Низкотемпературные рентгенографические исследования монокристаллов $TlInS_2$, $TlGaS_2$ и $TlGaSe_2$ <i>А. У. Шелег, В. В. Шевицова, В. Г. Гуртовой, С. Н. Мустафаева, Э. М. Керимова</i>	39
Рентгено-интерферометрическое исследование полей деформаций в кристаллах кремния, возникающих под действием постоянного магнитного поля <i>Г. Р. Дрмеян, А. О. Абоян, А. А. Мовсисян</i>	43
Структура поверхности крупногабаритных монокристаллов германия <i>И. А. Каплунов, О. В. Малышкина, А. И. Колесников, Р. М. Гречишкин, Е. И. Каплунова, А. И. Иванова</i>	47
Влияние температуры и электронного облучения на состав поверхности силикатной полупроводящей глазури <i>И. Н. Сергеев, В. К. Кумыков, В. А. Созаев</i>	51
Структура и электронные свойства поверхности оксианионных кристаллов <i>Д. В. Корабельников, Ю. Н. Журавлев</i>	55
О выборе начального приближения в методе конфлюэнтного анализа для катодолюминесцентной идентификации параметров прямозонных полупроводниковых материалов при квадратичной рекомбинации неосновных носителей заряда <i>Н. А. Никифорова, А. Н. Поляков, Н. Н. Михеев, М. А. Степович</i>	60
О модифицированной проекционной схеме метода наименьших квадратов для моделирования распределения неосновных носителей заряда, генерированных электронным пучком в однородном полупроводниковом материале <i>Е. В. Серегина, М. А. Степович, А. М. Макаренко</i>	65
Измерение нелинейности сканирования в растровом электронном микроскопе <i>Ю. А. Новиков</i>	70
Тушение люминесценции в оксиде цинка, модифицированном нанопорошками Al_2O_3 и $Al_2O_3 \cdot CeO_2$, при облучении протонами <i>М. М. Михайлов, В. В. Нецименко, Чундун Ли, Банг-Дзю Йе</i>	75

Численное моделирование высокоперевансной ионно-оптической системы с плазменным эмиттером <i>В. К. Абгарян, Р. В. Ахметжанов, Х. В. Лёб, В. А. Обухов, М. В. Черкасова</i>	82
Исследование углового и энергетического распределения ионов Na ⁺ и K ⁺ , прошедших через тонкие пленки меди <i>З. А. Исаханов</i>	91
Особенности воздействия вакуумного дугового разряда на поверхность металлического катода в присутствии гидроксидов и хлоридов щелочных металлов <i>В. Н. Арустамов, Х. Б. Ашуров, А. М. Миркаримов, С. Л. Пожаров, Х. Х. Кадыров, И. Х. Худайкулов</i>	95
Влияние низкотемпературного (20–60°C) нагрева кремния на его микротвердость <i>Д. И. Тетельбаум, Е. В. Курильчик, Г. П. Похил, А. А. Кузьмина (Пяткина)</i>	102
Об отрицательном значении поверхностной энергии при сжатии или растяжении кристалла <i>М. Н. Магомедов</i>	107
